



Retsch Technology GmbH
Marketing
Rheinische Straße 43
42781 Haan

Anmeldung

Bitte faxen oder schicken Sie die Antwortkarte unterschrieben an uns zurück. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung sowie einen Reiseplan. Die Teilnehmerzahl ist auf ca. 20 Personen begrenzt, um ein effektives Arbeiten und Kennenlernen der Geräte zu ermöglichen. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sollten Sie trotz Anmeldung nicht teilnehmen können, bitten wir Sie, uns dies bis zum 26.05.2008 mitzuteilen.

Die Teilnahmegebühr beträgt je Teilnehmer € 100,00 (zzgl. MwSt.) und beinhaltet Seminarunterlagen, ein Teilnahmezertifikat sowie Pausengetränke und das Mittagessen.

Das Seminar gilt als Weiterbildungsmaßnahme für Mitarbeiter von zertifizierten Unternehmen (DIN ISO 9000 ff.).

Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr bis zum 28.05.2008 auf folgendes Konto:

ING Bank Deutschland AG
Konto 0 010 110 070, BLZ 500 210 00
Verwendungszweck „Partikelseminar“

Veranstaltungsorte

Die Veranstaltungsorte entnehmen Sie bitte der Antwortkarte. Die genauen Adressen des Veranstaltungsortes erhalten Sie zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung per E-Mail rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn.

Referenten

Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen geben ihr Know-How und ihre langjährige Erfahrung in der Partikelmesstechnik an Sie weiter.



Dipl.-Phys. Gerhard Raatz
Leiter
Direktvertrieb

Retsch Technology GmbH,
Haan

Verfahrenstechnisch geprägter Physiker mit jahrelanger Erfahrung in Anwendung und Vertrieb optischer Partikelmesssysteme.



Dipl.-Ing. Gert Beckmann
Internationaler Vertrieb
und Produktmanagement

Retsch Technology GmbH,
Haan

Produktmanager Pulver-/Granulat-Analytik bei Retsch Technology. Verantwortlich für die Bildanalyse mit dem Camsizer.



Dipl.-Geol. Kai Düffels
Applikationsspezialist

Retsch Technology GmbH,
Haan

Fachberater im Applikationslabor von Retsch Technology.



Dipl.-Chem. Frank Meier
Vertrieb und
Anwendungstechnik

Retsch Technology GmbH,
Haan

Produktspezialist für Laserstreuicht-Messgeräte.

Gastreferent: Dr. Diethelm Fröse, Software Solutions



Retsch Technology GmbH
Marketing
Rheinische Straße 43
42781 Haan

Telefon 0 21 29 / 55 61 - 0
Telefax 0 21 29 / 55 61 - 87

E-Mail technology@retsch.de
Internet www.retsch-technology.de

a VERDER company

Seminar- einladung



**Partikelmesstechnik
in Theorie und Praxis**



Solutions in Particle Sizing

Methodenvergleich – welche Methode ist die richtige für Sie?

Die konstante Qualität von Produkten ist heute mitverantwortlich für den unternehmerischen Erfolg. Die Optimierung von Produktionsabläufen setzt genaue und zuverlässige Messverfahren voraus. Auch in der Forschung und Entwicklung kommt es auf exakte und reproduzierbare Analyseergebnisse an. Innovative Technik und Anwendungs-Know-How in der Partikelmesstechnik sichern dabei die Qualität Ihrer Produkte, optimieren Ihre Prozesse und gewährleisten gleichbleibende und kostengünstige Ergebnisse.

Seminarinhalt und Zielsetzungen

Das Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick über die modernen technischen Lösungen und Verfahren der Korngrößencharakterisierung: vom Nanopartikel bis zum Kieselstein. Zu diesem Zweck stellen wir Ihnen die unterschiedlichsten Messverfahren in Theorie und Praxis vor:

- Siebanalyse
- Digitale Bildverarbeitung
- Laserbeugung
- Dynamische Laserlichtstreuung

Dabei zeigen wir Ihnen das ganze Spektrum der Partikelmesstechnik von 1 nm bis ca. 30 mm.

Teilnehmerkreis

Das Seminar wendet sich an alle Personen, die in ausführender und/oder leitender Funktion Emulsionen, Suspensionen, Pulver und Granulate zu spezifizieren und zu charakterisieren haben.

Praxisseminar

Sie können nicht nur Ihre theoretischen Kenntnisse vertiefen, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, in dem umfangreichen Praxisteil an den verschiedensten Messgeräten zu arbeiten, um so alle Techniken und Methoden selbst zu erleben.

Anwendungen finden Sie in nahezu allen Branchen, wie z.B.

- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Bauindustrie
- Glas- und Keramikindustrie
- Düngemittelindustrie
- Pharmaindustrie u.v.m.



Programm

9:00 – 9:15 Begrüßung

Teil 1 Von Nanometer bis Millimeter – Partikelgrößenanalyse mittels Streulichtmethoden

9:15 – 9:45 Die Bedeutung der Probenvorbereitung
(Frank Meier, Retsch Technology)

9:45 – 10:15 Laserbeugung und dynamische Lichtstreuung
(Gerhard Raatz, Retsch Technology)

10:15 – 10:30 Pause

10:30 – 11:15 Trennverfahren und Lichtstreuung zur hochauflösenden Nanopartikelanalyse
(Dr. Diethelm Fröse, Software Solutions)

Teil 2 Partikelgrößen- und Partikelformanalyse an Pulvern & Granulaten

11:15 – 11:45 Siebanalysen im Rahmen der QS nach DIN ISO 9000 ff
(Kai Düffels, Retsch Technology)

11:45 – 12:00 Pause

12:00 – 12:45 Dynamische Bildanalyse gemäß ISO 13322-2 mit dem CAMSIZER®
(Gert Beckmann, Retsch Technology)

12:45 – 14:00 Mittagspause

Teil 3 Praxis

14:00 – 17:00 Erfahrungsaustausch, Messungen an den Geräten

Die Referenten und Vortragsthemen sind unverbindlich und können sich kurzfristig ändern.

Anmeldung

Sie können sich anmelden
per Fax unter: **02129-5561-213** oder
online unter: www.retsch-technology.de

Ich melde mich zu folgendem Seminar an:

- Montag, 09.06.2008 in Hannover
- Dienstag, 10.06.2008 in Haan (bei Düsseldorf)
- Mittwoch, 11.06.2008 in Mannheim
- Donnerstag, 12.06.2008 in Ismaning (bei München)

Name, Vorname

Firma/Institut

Abteilung

Straße/Gebäude

PLZ, Ort

Telefon/Telefax

E-Mail*

Datum, Unterschrift

*Sie erhalten die Anmeldebestätigung per E-Mail